

# InspectEye

非破壊粒子観察/カウンティング装置

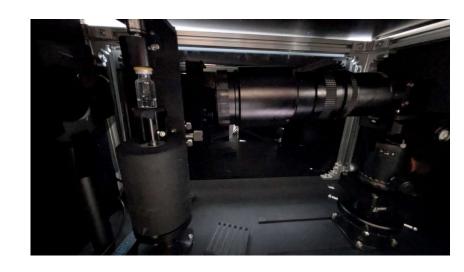
ライフィクスアナリティカル株式会社

#### InspectEye 特徵

- ▶ 光源:可視光
  - ▶ サンプルにマイルドな可視光を使用した光学観察系装置
- ▶ 異物と目的粒子を一粒子から検出
  - ▶ バイアルを回転攪拌により浮遊させて画像解析
  - Specification: 50 μ m~(実測では20 μ m検出も確認)
  - ▶ ソフトウェアで閾値設定も可
- ▶ テレセントリック光学系レンズを採用
  - ▶ バイアル全体の画像を取得/解析が可能
- ▶ 独自の差分アルゴリズム機能を追加
  - ▶ バイアルの汚れや埃の付着などの異物とサンプルを区別
  - > 異物のみを正確に検出
- ▶ 検出した画像を1粒子単位で保存可能
  - ▶ 機械学習させる際の元データに利用

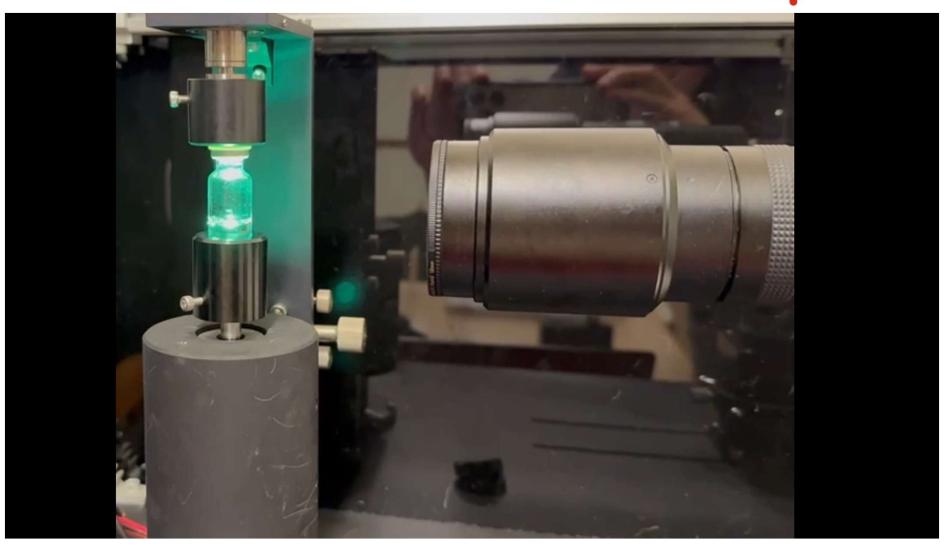






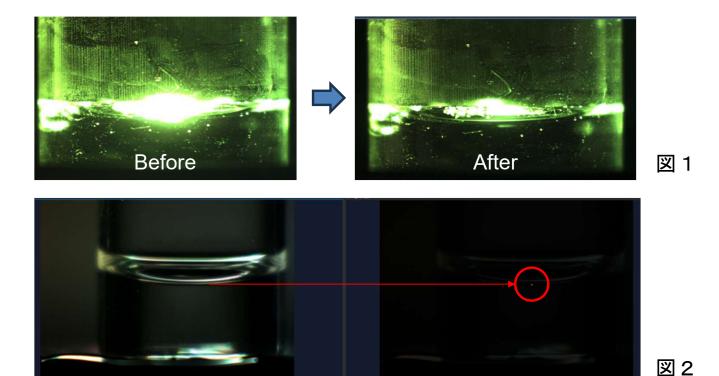
# InspectEye 測定部





### InspectEye アップデート①

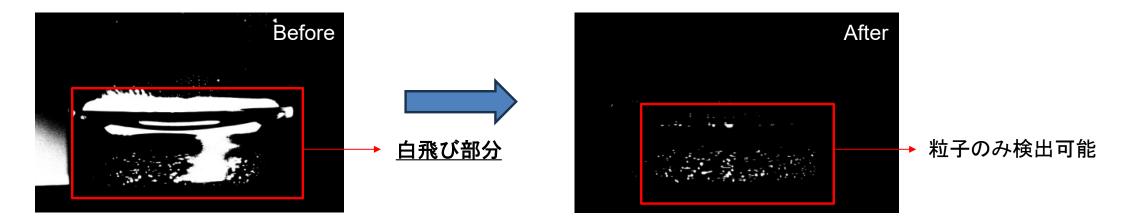




- ▶ バイアル反射光の低減
- ▶ 粒子の検出の妨げとなる照明の反射光をカット(図1)
- ▶ 検出エリアの拡大および、表面に浮いている異物の検出することが可能(図2)

### InspectEye アップデート②





#### ▶ 画像の明るさムラ補正機能

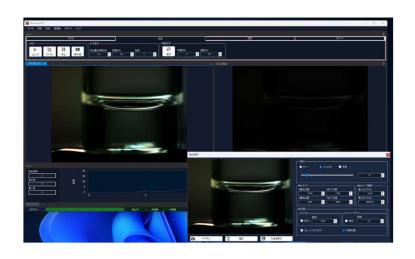
※サンプル由来ではない部分で画像内に明るさのムラがある(反射光による<u>白飛び</u>など)と反射光付近の閾値は高く、それ以外の箇所の閾値は低くするなど、ひとつの閾値パラメータでは異物を観察するうえでの良い二値化は困難

#### InspectEye

- ▶ 反射光をカットする仕組み
- ▶ 差分検出を行うため画像内のむらを除去が可能
- これらによりバイアル全体をひとつの二値化パラメータ処理が可能→効率的な粒子検出が可能

### InspectEye ソフトウェア

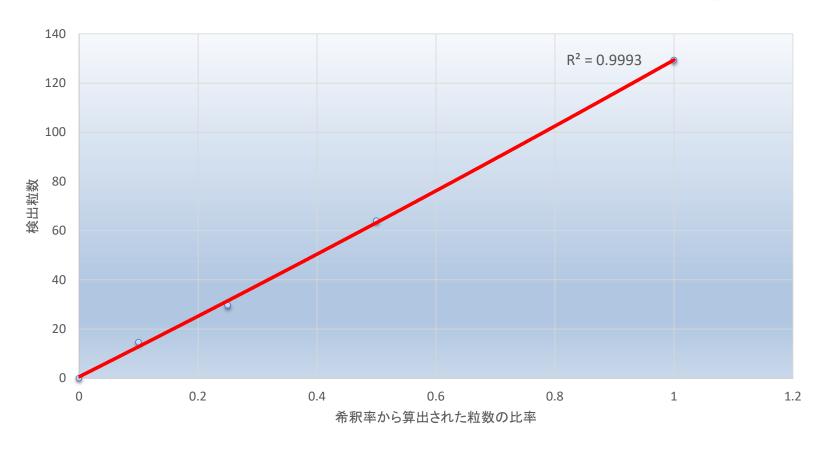




- ▶ セットアップを簡素化
- > 迅速な結果取得
- ▶ 制御/検出のシーケンス構築から機械学習まで 統括したオールインワンパッケージ仕様
- ▶ マシンラーニング解析
  - ① 検出した異物のクラス分類
  - ② 機械学習とルールベースツールを1つのビジョンシステムに統合
  - ③ 検出した異物が何由来のものであるかなど、 ユーザー任意のクラスに学習/分類

## InspectEye 検出結果





- 50 μ mの標準粒子(ポリエステル)を希釈系列(x2, x5, x10)測定
- ➤ 結果:R<sup>2</sup>=0.9993